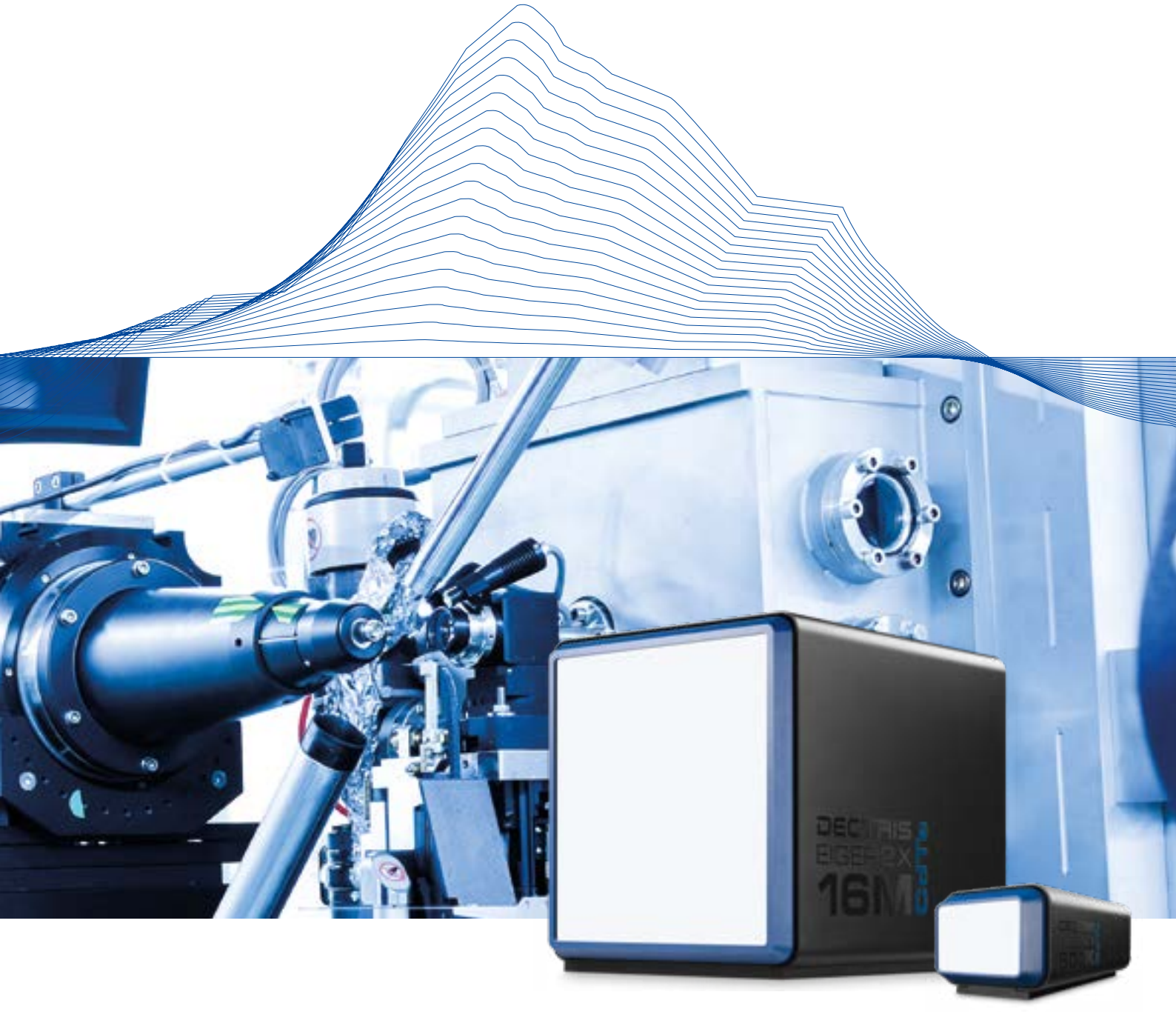
DECTRIS
detecting the future



EIGER2 X CdTe

用于高能探测的高分辨探测器



第4代同步加速器的高端技术

EIGER2 X CdTe 探测器适用于需要在高能量下获得超高分辨率和帧速率的科学家。您现在可以以 75µm 的单像素级空间分辨率检测能量高达 100keV 的光子。由于无死区时间读数，您不会在帧之间丢失光子。第二个能量区分阈值允许您在两个能量窗中对样品进行成像或削减高次谐波，以减少背景噪音。以10^7光子/秒/像素的超高计数率能力来配备您的光束实验站，为未来做好准备。

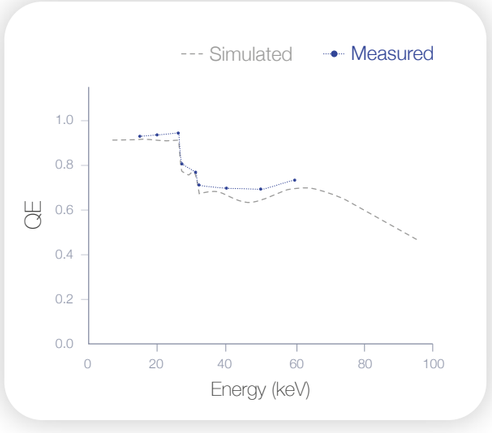
EIGER2 X CdTe探测器将超高性能与易于集成和操作结合在一起。

核心优势

- 高量子效率范围达100KeV
- 无图像延迟或余辉
- 计数速率高达10^7光子/秒/像素
- 双能量阈值
- 电子门控触发
- 有效面积大

应用领域

- X射线衍射(单晶和粉末)
- 现场和原位技术
- 衍射显微镜和层析成像
- 漫散射和对分布函数



测量和模拟的量子效率 (QE) 作为X射线能量的函数。

技术规格

EIGER2 X CdTe	500K	1M	4M	9M	16M
探测器模块数量	1	1×2	2×4	3×6	4×8
有效面积: 宽x高 [mm2]	77.2 x 38.6	77.2 × 79.9	155.2 × 162.5	233.2 × 245.2	311.2 × 327.8
像素大小 [µm2]			75 × 75		
能量阈值数量			2		
计数率 [ph/s/pixel]			10^7		
点扩散函数 [pixel]			1		
传感器厚度 [µm]			750		
数据格式			HDF5 / NeXus		
帧频 [Hz]	2,000	2,000	500	230	130
尺寸 (WHD) [mm3]	114 x 92 x 242	114 × 133 × 240	235 × 237 × 372	340 × 370 × 500	400 × 430 × 500
重量 [kg]	3.3	4.7	15	41	55

所有规格如有更改，恕不另行通知。





DECTRIS Ltd.
Täfernweg 1
5405 Baden-Dättwil
Switzerland

Phone +41 56 500 21 00
Fax +41 56 500 21 01
E-Mail sales@dectris.com
www.dectris.com

Registered trademarks: “DECTRIS”: EU, JP, CN, KR (IR0911969), USA (5,253,168); “detecting the future”: CN, KR, JP, EU, AUS (IR1191333), USA (4,607,800); „DECTRIS EIGER“: EU, JP, CN, KR, CH, AUS (IR1350410), USA (5,415,155);
© 2021 DECTRIS Ltd., all rights reserved, subject to technical modifications
Printed 01/2021